Методы машинного обучения Метрические методы классификации и регрессии

Воронцов Константин Вячеславович www.MachineLearning.ru/wiki?title=User:Vokov вопросы к лектору: voron@forecsys.ru

материалы курса:

github.com/MSU-ML-COURSE/ML-COURSE-22-23 орг.вопросы по курсу: ml.cmc@mail.ru

ВМК МГУ • 13 сентября 2022

Содержание

- 1 Определение расстояний между объектами
 - Гипотезы компактности или непрерывности
 - Векторные меры близости
 - Беспризнаковые способы вычисления расстояний
- Метрические методы классификации
 - Обобщённый метрический классификатор
 - От ближайшего соседа к потенциальным функциям
 - Задача отбора эталонных объектов
- 3 (Непара)метрические методы регрессии
 - Ядерное сглаживание (kernel smoothing)
 - Обоснование ядерного сглаживания
 - ullet Выбор ядра K и ширины окна h

Гипотезы непрерывности и компактности

Задачи классификации и регрессии:

$$X$$
 — объекты, Y — ответы; $X^{\ell} = (x_i, y_i)_{i=1}^{\ell}$ — обучающая выборка;

Гипотеза непрерывности (для регрессии): близким объектам соответствуют близкие ответы.

выполнена:

не выполнена:



Гипотеза компактности (для классификации): близкие объекты, как правило, лежат в одном классе.



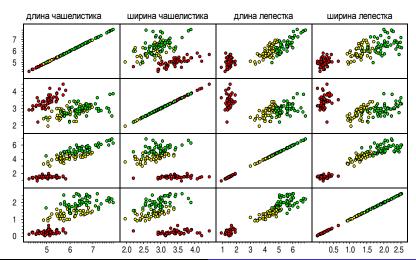


не выполнена:



Пример: задача классификации цветков ириса [Фишер, 1936]

Привычная мера близости — евклидова метрика в \mathbb{R}^2 .



Формализация понятия «близости»

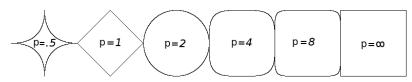
Евклидова метрика и обобщённая метрика Минковского:

$$\rho(x, x_i) = \left(\sum_{j=1}^n |x^j - x_i^j|^2\right)^{1/2} \quad \rho(x, x_i) = \left(\sum_{j=1}^n w_j |x^j - x_i^j|^p\right)^{1/p}$$

$$x = (x^1, ..., x^n)$$
 — вектор признаков объекта x_i
 $x_i = (x_i^1, ..., x_i^n)$ — вектор признаков объекта x_i ,

 w_1, \ldots, w_n — веса признаков, которые можно обучать.

Эквидистантные поверхности при различных p:

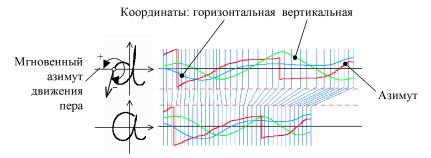


Расстояния между строками / сигналами

Для строк — редакторское расстояние Левенштейна:

CTGGGCTAAAAGGTCCCTTAGCC..TTTAGAAAAA.GGGCCATTAGGAAATTGC CTGGGACTAAA....CCTTAGCCTATTTACAAAAATGGGCCATTAGG...TTGC

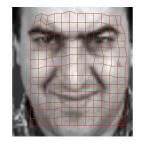
Для сигналов — энергия сжатий и растяжений:

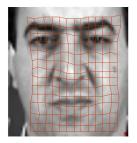


Расстояния между изображениями

Расстояние между изображениями на основе выравнивания:







Оценивается энергия растяжения прямоугольной сетки

Обобщённый метрический классификатор

Для произвольного $x \in X$ отранжируем объекты x_1, \ldots, x_ℓ :

$$\rho(x,x^{(1)}) \leqslant \rho(x,x^{(2)}) \leqslant \cdots \leqslant \rho(x,x^{(\ell)}),$$

 $x^{(i)} - i$ -й сосед объекта x среди x_1, \ldots, x_ℓ ; $y^{(i)}$ — ответ на i-м соседе объекта x.

Метрический алгоритм классификации:

$$a(x; X^{\ell}) = \arg \max_{y \in Y} \underbrace{\sum_{i=1}^{\ell} \left[y^{(i)} = y \right] w(i, x)}_{\Gamma_{V}(x)},$$

w(i,x) — вес (степень важности) i-го соседа объекта x, неотрицателен, не возрастает по i.

 $\Gamma_{v}(x)$ — оценка близости объекта x к классу y.

Mетод k ближайших соседей (k nearest neighbors, kNN)

$$w(i,x)=[i\leqslant 1]$$
 — метод ближайшего соседа $w(i,x)=[i\leqslant k]$ — метод k ближайших соседей

Преимущества:

- простота реализации (lazy learning);
- ullet параметр k можно оптимизировать по leave-one-out:

$$\mathsf{LOO}(k, X^{\ell}) = \sum_{i=1}^{\ell} \left[a(x_i; X^{\ell} \setminus \{x_i\}, k) \neq y_i \right] \to \min_{k}.$$

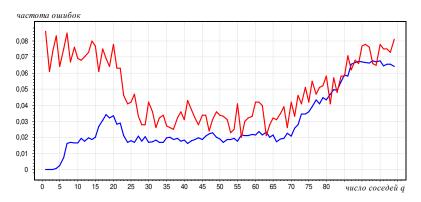
Недостатки:

- ullet неоднозначность классификации при $\Gamma_y(x)=\Gamma_s(x),\ y
 eq s.$
- не учитываются значения расстояний



Зависимость LOO от числа соседей

Пример. Задача UCI: Iris.



- смещённое число ошибок, когда объект учитывается как сосед самого себя
- несмещённое число ошибок LOO

Метод k взвешенных ближайших соседей

$$w(i,x)=[i\leqslant k]w_i,$$
где w_i — вес, зависящий только от номера соседа;

Возможные эвристики:

$$w_i = rac{k+1-i}{k}$$
 — линейное убывающие веса; $w_i = q^i$ — экспоненциально убывающие веса, $0 < q < 1$;

Проблемы:

- как более обоснованно задать веса?
- возможно, было бы лучше, если бы вес w(i,x) зависел не от порядкового номера соседа i, а от расстояния до него $\rho(x,x^{(i)})$.



Метод окна Парзена

$$w(i,x)=K\Big(rac{
ho(x,x^{(i)})}{h}\Big)$$
, где h — ширина окна, $K(r)$ — ядро, не возрастает и положительно на $[0,1]$.

Метод парзеновского окна фиксированной ширины:

$$a(x; X^{\ell}, h, K) = \arg \max_{y \in Y} \sum_{i=1}^{\ell} [y_i = y] K\left(\frac{\rho(x, x_i)}{h}\right)$$

Метод парзеновского окна переменной ширины:

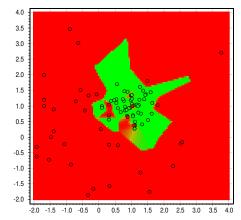
$$a(x; X^{\ell}, \mathbf{k}, K) = \arg\max_{y \in Y} \sum_{i=1}^{\ell} [y_i = y] K\left(\frac{\rho(x, x_i)}{\rho(x, x^{(k+1)})}\right)$$

Оптимизация параметров — по критерию LOO:

- ullet выбор ширины окна h или числа соседей k
- ullet выбор ядра K

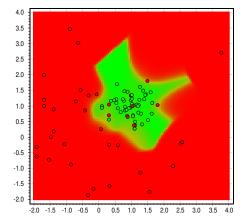
$$a(x) = \arg \max_{y \in Y} \Gamma_y(x) = \operatorname{sign}(\underbrace{\Gamma_{+1}(x) - \Gamma_{-1}(x)})$$

$$h = 0.05$$



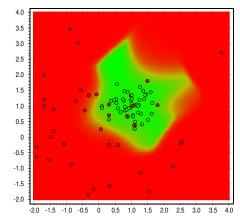
$$a(x) = \arg \max_{y \in Y} \Gamma_y(x) = \operatorname{sign}(\underbrace{\Gamma_{+1}(x) - \Gamma_{-1}(x)})$$

$$h = 0.2$$



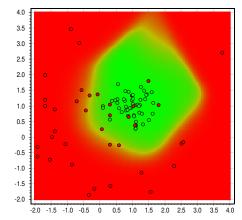
$$a(x) = \arg \max_{y \in Y} \Gamma_y(x) = \operatorname{sign}(\underbrace{\Gamma_{+1}(x) - \Gamma_{-1}(x)})$$

$$h = 0.3$$



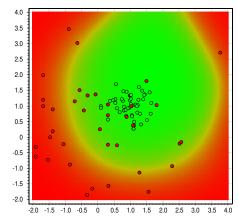
$$a(x) = \arg \max_{y \in Y} \Gamma_y(x) = \operatorname{sign}(\underbrace{\Gamma_{+1}(x) - \Gamma_{-1}(x)})$$

$$h = 0.5$$



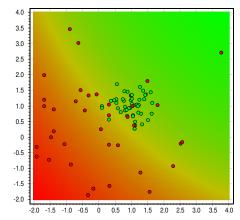
$$a(x) = \arg \max_{y \in Y} \Gamma_y(x) = \operatorname{sign}(\underbrace{\Gamma_{+1}(x) - \Gamma_{-1}(x)})$$

$$h = 1.0$$



$$a(x) = \arg \max_{y \in Y} \Gamma_y(x) = \operatorname{sign}(\underbrace{\Gamma_{+1}(x) - \Gamma_{-1}(x)})$$

$$h = 5.0$$



Обобщённый метрический классификатор
От ближайшего соседа к потенциальным функциям
Задача отбора эталонных объектов

Метод потенциальных функций

$$w(i,x) = \gamma^{(i)} K\left(\frac{\rho(x,x^{(i)})}{h^{(i)}}\right)$$

Более простая запись (здесь можно не ранжировать объекты):

$$a(x; X^{\ell}) = \arg \max_{y \in Y} \sum_{i=1}^{\ell} [y_i = y] \gamma_i K\left(\frac{\rho(x, x_i)}{h_i}\right),$$

где γ_i — веса объектов, $\gamma_i \geqslant 0$, $h_i > 0$.

Физическая аналогия из электростатики:

 γ_i — величина «заряда» в точке x_i ;

 h_i — «радиус действия» потенциала с центром в точке x_i ;

 y_i — знак «заряда» (в случае двух классов $Y = \{-1, +1\}$);

$$K(r) = \frac{1}{r}$$
 или $\frac{1}{r+a}$

В задачах классификации нет ограничений ни на K, ни на |Y|.

Метод потенциальных функций = линейный классификатор

Два класса:
$$Y = \{-1, +1\}$$
.
$$a(x; X^{\ell}) = \arg\max_{y \in Y} \Gamma_y(x) = \operatorname{sign} \left(\Gamma_{+1}(x) - \Gamma_{-1}(x)\right) =$$

$$= \operatorname{sign} \sum_{i=1}^{\ell} \gamma_i y_i \, K\left(\frac{\rho(x, x_i)}{h_i}\right).$$

Сравним с линейной моделью классификации:

$$a(x) = \operatorname{sign} \sum_{j=1}^{n} \gamma_{j} f_{j}(x).$$

- $f_j(x) = y_j K\left(\frac{1}{h_i} \rho(x, x_j)\right)$ новые признаки объекта x
- ullet γ_j веса линейного классификатора
- ullet $n=\ell$ число признаков равно числу объектов обучения

Полный скользящий контроль CCV

Функционал *полного* скользящего контроля (complete cross-validation, CCV):

$$\mathsf{CCV}(X^L) = \frac{1}{C_L^{\ell}} \sum_{X^{\ell} \sqcup X^k} \frac{1}{k} \sum_{x_i \in X^k} \left[a(x_i, X^{\ell}) \neq y_i \right],$$

т.е. частота ошибок на контрольной выборке, усреднённая по всем C_L^ℓ разбиениям выборки $X^L = X^\ell \sqcup X^k$ на обучающую подвыборку X^ℓ и контрольную X^k .

Замечание 1. При k=1 имеем: $CCV(X^L) = LOO(X^L)$.

Замечание 2. CCV характеризует лишь среднюю частоту ошибок, но не характеризует её дисперсию.

Mullin M., Sukthankar R. Complete cross-validation for nearest neighbor classifiers. 2000

Понятие профиля компактности

Профиль компактности выборки X^L — это функция доли объектов x_i , у которых m-й сосед $x_i^{(m)}$ лежит в другом классе:

$$\Pi(m, X^L) = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^{L} [y_i \neq y_i^{(m)}]; \quad m = 1, \dots, L-1,$$

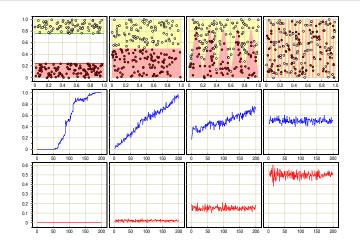
 $x_i^{(m)} - m$ -й сосед объекта x_i среди X^L ; $y_i^{(m)}$ — ответ на m-м соседе объекта x_i .

Теорема (точное выражение CCV для метода 1NN)

$$CCV(X^{L}) = \sum_{m=1}^{k} \frac{\prod(m, X^{L})}{C_{L-1-m}^{\ell}}.$$

Воронцов К.В. Комбинаторный подход к оценке качества обучаемых алгоритмов. 2004

Профили компактности для серии модельных задач



средний ряд: профили компактности, нижний ряд: зависимость CCV от длины контроля k.

Свойства профиля компактности и оценки ССУ

• Профиль $\Pi(m, X^L)$ формализует гипотезу компактности:

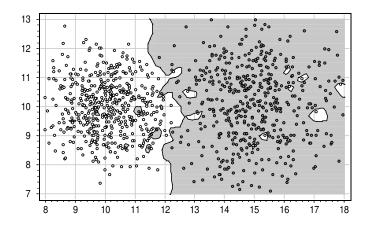
$$CCV(X^{L}) = \sum_{m=1}^{k} \Pi(m, X^{L}) \gamma_{L}^{\ell}(m)$$

- ullet Для CCV o min важен только начальный участок профиля, т. к. $\gamma_L^\ell(m) = \frac{C_{L-1-m}^{\ell-1}}{C_L^\ell}$ убывает экспоненциально по m
- ullet CCV практически не зависит от длины контроля k
- Отбор эталонов (prototype selection) как можно меньшего числа объектов с минимальным вкладом Π_i :

$$\mathsf{CCV}(X^L) = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^{L} \Pi_i, \quad \Pi_i = \sum_{m=1}^{k} \left[y_i \neq y_i^{(m)} \right] \gamma_L^{\ell}(m)$$

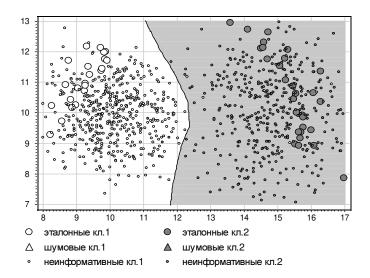
Воронцов К.В., Иванов М.Н. Отбор эталонов, основанный на минимизации функционала полного скользящего контроля. 2009

Модельные данные

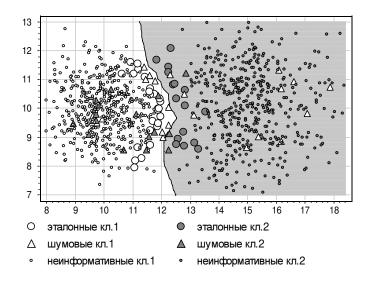


Модельная задача классификации: 1000 объектов. Алгоритм 1NN

Последовательное жадное добавление эталонных объектов



Последовательное жадное удаление не-эталонных объектов



Последовательный отсев не-эталонных объектов

Зависимость CCV от числа удаленных неэталонных объектов.



При отборе эталонов по критерию CCV переобучения нет.

Воронцов К.В., Иванов М.Н. Отбор эталонов, основанный на минимизации функционала полного скользящего контроля. 2009

Задачи регрессии и метод наименьших квадратов

- X объекты (часто \mathbb{R}^n); Y ответы (часто \mathbb{R} , реже \mathbb{R}^m); $X^\ell = (x_i, y_i)_{i=1}^\ell$ обучающая выборка; $y_i = y(x_i), \ y \colon X \to Y$ неизвестная зависимость;
- $a(x) = f(x, \theta)$ параметрическая модель зависимости, $\theta \in \mathbb{R}^p$ вектор параметров модели.
- Метод наименьших квадратов (МНК):

$$Q(\theta, X^{\ell}) = \sum_{i=1}^{\ell} w_i (f(x_i, \theta) - y_i)^2 \to \min_{\theta},$$

где w_i — вес, степень важности i-го объекта.

• Недостаток:

надо иметь хорошую параметрическую модель $f(x,\theta)$

Непараметрическая регрессия, формула Надарая-Ватсона

Приближение константой $f(x,\theta)=\theta$ в окрестности $x\in X$:

$$Q(\theta; X^{\ell}) = \sum_{i=1}^{\ell} w_i(x) (\theta - y_i)^2 \to \min_{\theta \in \mathbb{R}};$$

Формула ядерного сглаживания Надарая-Ватсона:

$$a_h(x; X^{\ell}) = \frac{\sum_{i=1}^{\ell} y_i w_i(x)}{\sum_{i=1}^{\ell} w_i(x)} = \frac{\sum_{i=1}^{\ell} y_i K\left(\frac{\rho(x, x_i)}{h}\right)}{\sum_{i=1}^{\ell} K\left(\frac{\rho(x, x_i)}{h}\right)}.$$

Обоснование формулы Надарая-Ватсона (одномерный случай)

Теорема

Пусть выполнены следующие условия:

- 1) выборка $X^{\ell} = (x_i, y_i)_{i=1}^{\ell}$ простая, из распределения p(x, y);
- 2) ядро K(r) ограничено: $\int_0^\infty K(r) dr < \infty$, $\lim_{r \to \infty} rK(r) = 0$;
- 3) зависимость E(y|x) не имеет вертикальных асимптот: $E(y^2|x) = \int_{\mathcal{V}} y^2 p(y|x) \ dy < \infty$ при любом $x \in X$;
- 4) последовательность h_ℓ убывает, но не слишком быстро:

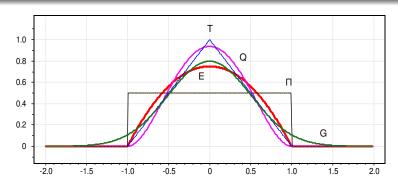
$$\lim_{\ell\to\infty}h_\ell=0,\ \lim_{\ell\to\infty}\ell h_\ell=\infty.$$

Тогда имеет место сходимость по вероятности:

$$\mathsf{a}_{h_\ell}(\mathsf{x};\mathsf{X}^\ell) \overset{P}{ o} \mathsf{E}(\mathsf{y}|\mathsf{x})$$
 в любой точке $\mathsf{x} \in \mathsf{X}$,

в которой E(y|x), p(x) и D(y|x) непрерывны и p(x) > 0.

Часто используемые ядра K(r)



$$\Pi(r) = \left[|r| \leqslant 1 \right]$$
 — прямоугольное $T(r) = \left(1 - |r| \right) \left[|r| \leqslant 1 \right]$ — треугольное $E(r) = \left(1 - r^2 \right) \left[|r| \leqslant 1 \right]$ — квадратичное (Епанечникова) $Q(r) = (1 - r^2)^2 \left[|r| \leqslant 1 \right]$ — квартическое $G(r) = \exp(-2r^2)$ — гауссовское

$$h \in \{0.1, 1.0, 3.0\}$$
, гауссовское ядро $K(r) = \exp(-2r^2)$

Гауссовское ядро ⇒ гладкая аппроксимация Ширина окна существенно влияет на точность аппроксимации

$$h \in \{0.1, 1.0, 3.0\}$$
, треугольное ядро $K(r) = (1-|r|)[|r| \leqslant 1]$

Треугольное ядро \Rightarrow кусочно-линейная аппроксимация Аппроксимация не определена, если в окне нет точек выборки

$$h \in \{0.1, 1.0, 3.0\}$$
, прямоугольное ядро $K(r) = [|r| \leqslant 1]$

Прямоугольное ядро \Rightarrow кусочно-постоянная аппроксимация Выбор ядра слабо влияет на точность аппроксимации

- Ядро K(r)
 - существенно влияет на гладкость функции $a_h(x)$,
 - слабо влияет на качество аппроксимации.
- Ширина окна h
 - существенно влияет на качество аппроксимации.
- Переменная ширина окна по k ближайшим соседям:

$$w_i(x) = K\left(\frac{\rho(x, x_i)}{h(x)}\right), \qquad h(x) = \rho(x, x^{(k+1)})$$

где $x^{(k)} - k$ -й сосед объекта x.

• Оптимизация ширины окна по скользящему контролю:

$$\mathsf{LOO}(h, X^\ell) = \sum_{i=1}^\ell \Bigl(\mathsf{a}_h\bigl(x_i; X^\ell \backslash \{x_i\}\bigr) - \mathsf{y}_i \Bigr)^2 \to \min_h.$$

Резюме

- Метрические методы простейшие в машинном обучении, обучение сводится к запоминанию выборки (lazy learning)
- Что можно обучать:
 - число ближайших соседей k или ширину окна h
 - веса объектов
 - набор эталонов (prototype selection)
 - метрику (distance learning, similarity learning)
 - в частности, веса признаков в метрике
- Качество обучения зависит от метрики и ширины окна
- Непараметрическая регрессия обходится без модели? Нет, модельные предположения закладываются в метрику